



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky označené „Elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem (FIB-SEM)“

Název veřejného zadavatele	<b>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava</b>
Adresa zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Profil zadavatele	<a href="https://zakazky.vsb.cz/">https://zakazky.vsb.cz/</a>
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 13.6.2024 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem (FIB-SEM)“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

### **Dotaz č. 1:**

V příloze č.1 – Technická specifikace, část 3.2. je uvedeno

Je EBSD detektor vybaven bezkontaktními senzory k zamezení potenciální kolize detektoru s ostatními detektory nebo součástmi komory SEM-FIB? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 1.14]

Bezkontaktní sensor pracuje na fyzikálním principu, že vysílá elektromagnetické pole nebo paprsek elektromagnetického záření (například infračerveného) a hledá změny v poli/prostoru a zpětném odraženém signálu. To negativně ovlivňuje parametry elektronového svazku mikroskopu. Proto musí být bezkontaktní sensor při práci s mikroskopem (v režimu zobrazování/snímkování nebo analytickém režimu) vypnutý, jinak by kvalita zobrazení byla výrazně snížena.

Funkce bezkontaktního senzoru je tak velmi omezená a nemůže být využita v pracovních režimech mikroskopu.

Řešení, které nabízí náš EBSD system pracuje na principu prostého kontaktu. Jakmile se přední část detektoru dotkne stolku nebo jiné části komory, okamžitě dojde k retrakci detektoru. Rychlost najetí do pracovní pozice je na posledních 10mm zásadně zpomalena, aby nedošlo k poškození detektoru.

Naše řešení je funkční ve všech pracovních režimech mikroskopu.

Dotaz:

Bezdotykové sensory mají velmi omezené využití a neposkytují žádnou výhodu oproti dotykovým sensorům. Domníváme se, že by parameter uvedený v odstavci 3.2. neměl být součástí dílčích hodnotících kritérií, protože zvýhodňuje jiné dodavatele bez zřejmého technického přínosu pro práci s mikroskopem.

Žádáme tímto o vyřazení parametru „Je EBSD detektor vybaven bezkontaktními senzory k zamezení potenciální kolize detektoru s ostatními detektory nebo součástmi komory SEM-FIB?“ ze seznamu dílčích hodnotících kritérií.

Odpověď:

V technické specifikaci je uvedeno „EBSD detektor musí být vybaven kolizními senzory k zamezení potenciální kolize detektoru s ostatními detektory nebo součástmi komory SEM-FIB.“ Bezkontaktní sensor představuje ochranný systém navíc, který je hodnocen v rámci kvalitativního hodnotícího kritéria.

Rozšíření vybavení SEM-FIB o bezdotykový senzor (hodnotící položka 1.14) požadujeme z důvodu zvýšení bezpečnosti práce s elektronovým mikroskopem, který budou využívat jak Ph.D. studenti, tak VaV pracovníci. Při jakémkoliv dotyku detektoru je vysoká pravděpodobnost, že dojde k jeho poškození, z čehož plynou vysoké náklady na jeho opravu a omezení výzkumné činnosti. Z tohoto důvodu požadujeme bezpečnostní systém, který povede ke zvýšení ochrany tohoto detektoru. I když by byl v době snímkování nebo analytickém režimu bezdotykový senzor vypnutý, rizikovou operací je právě umístění detektoru do snímkovací pozice, která je velmi blízko vzorku.

Tedy vybavení systému bezdotykovými senzory není povinné, ale tato funkční vlastnost systému bude pro zadavatele výhodná z důvodu bezpečnosti a komfortu provozu.

V Ostravě

.....  
Ing. Miroslav Jílek  
specialista veřejných zakázek